

Quality Management System for Patent Examination at the JPO

21 June 2017

Hiromi TAKAOKA
Director, Quality Management Office

1. Quality Management System (QMS)

- i. Quality Policy on Patent Examination
- ii. Quality Manual / PDCA Cycle in QMS
- iii. Organizational Chart of JPO
- iv. Organization of Quality Management

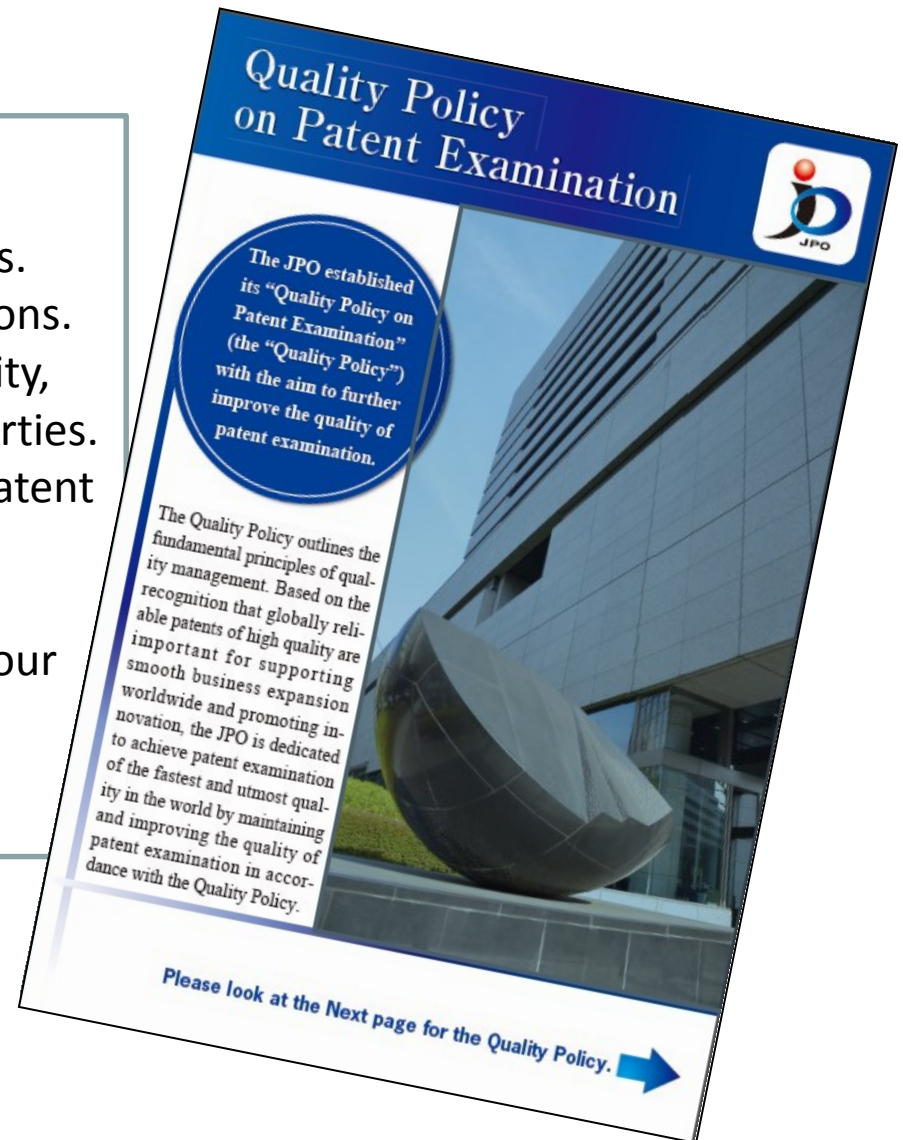
2. Quality Verification

3. Quality Assurance

4. Continuous Enhancement

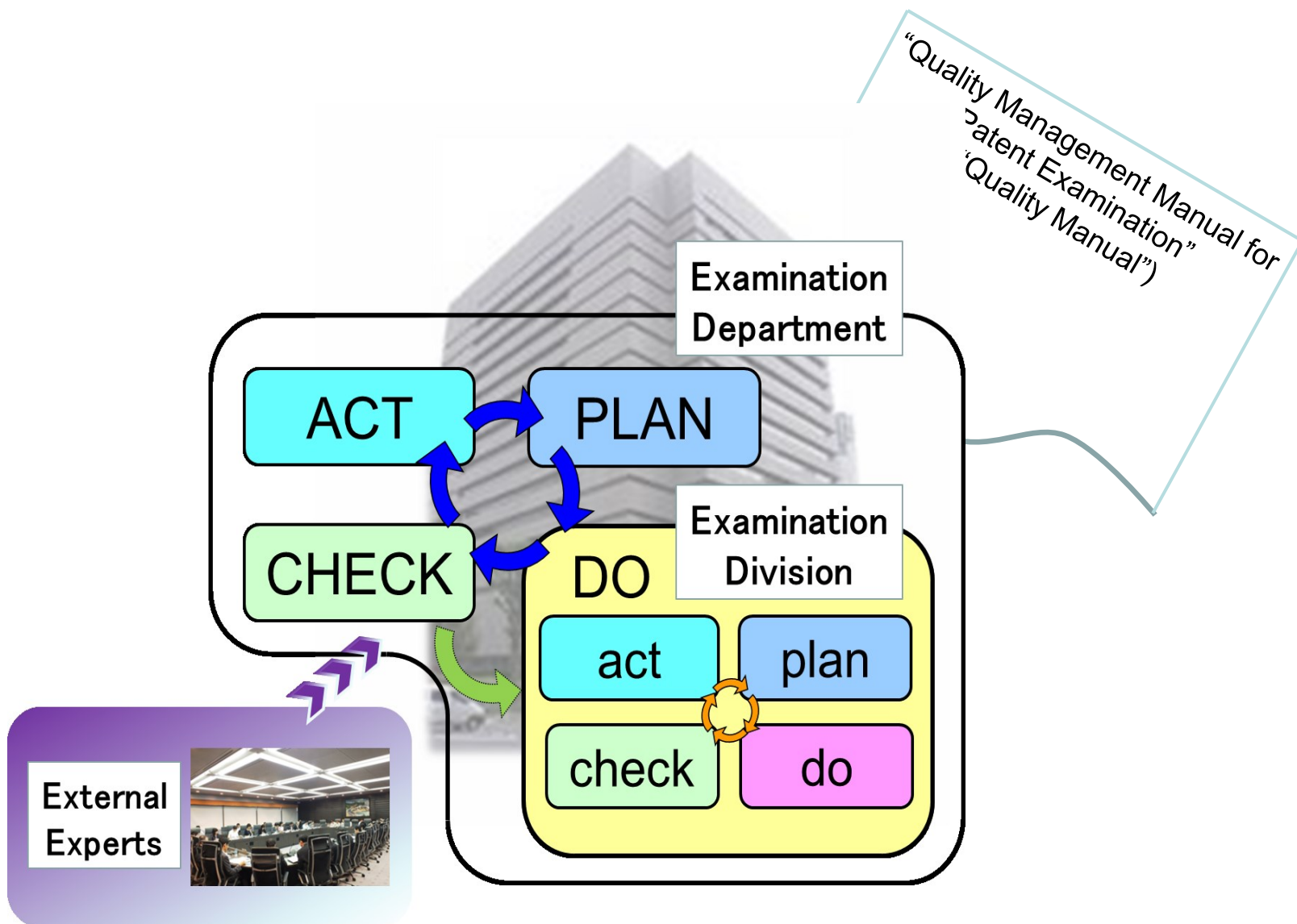
1. i. Quality Policy on Patent Examination

- We grant robust, broad and valuable patents.
- We meet wide-ranging needs and expectations.
- We all dedicate ourselves to improving quality, cooperating with concerned persons and parties.
- We contribute to improving the quality of patent examination globally.
- We continually improve operations.
- We raise the knowledge and capabilities of our staff.

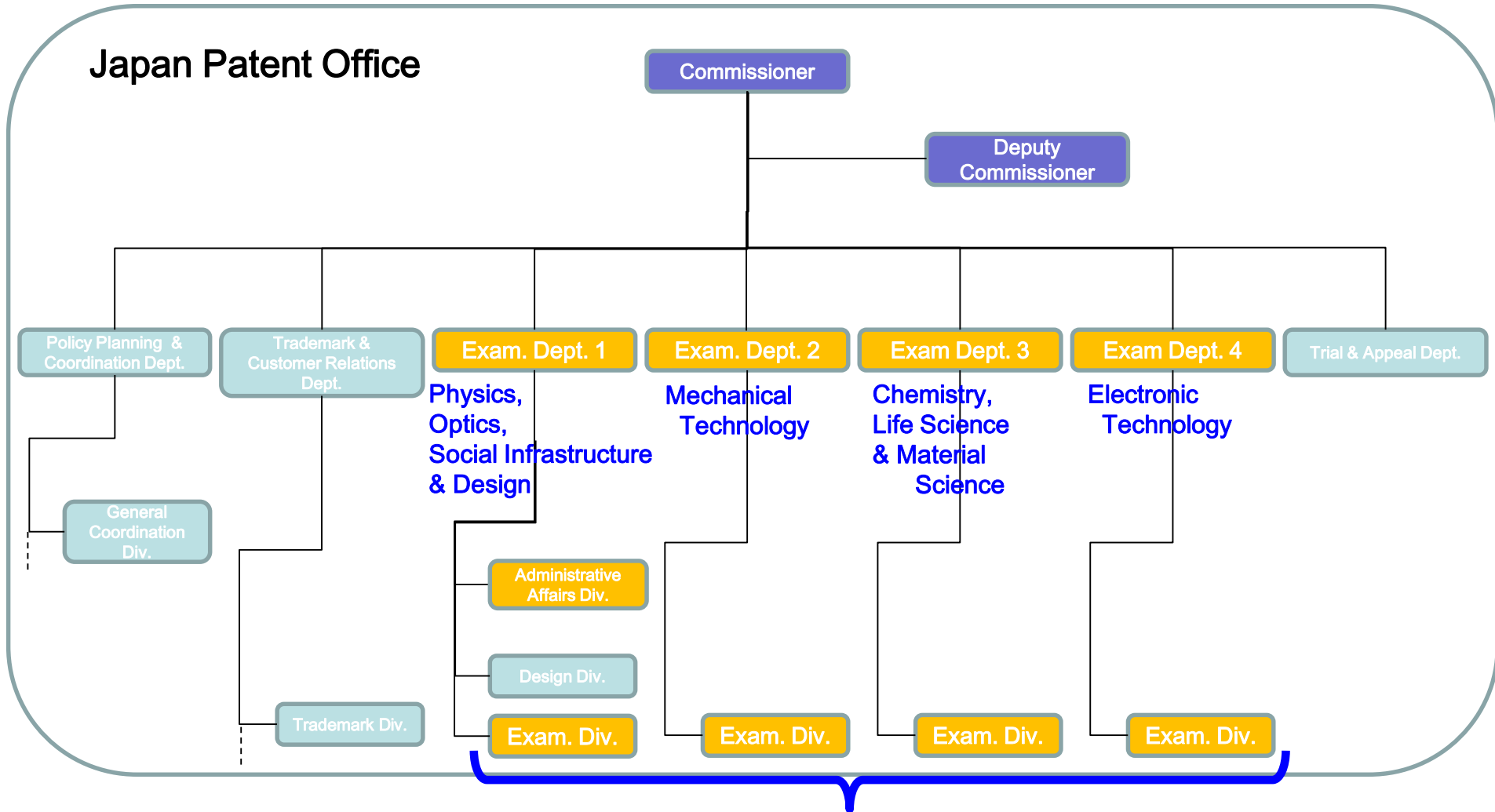


http://www.jpo.go.jp/seido_e/s_gaiyou_e/pdf/patent_policy/policy.pdf

1.ii. Quality Manual / PDCA Cycle in QMS

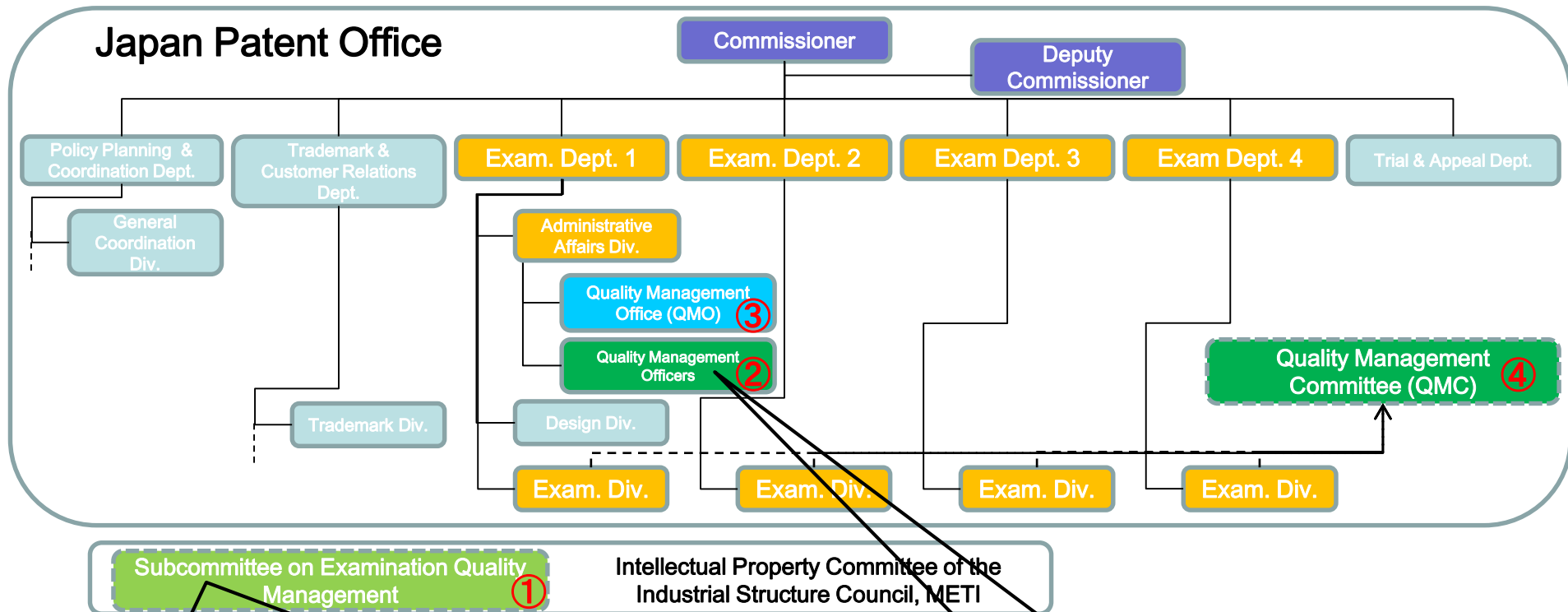


1.iii. Organizational Chart of JPO



- 38 Examination Divisions
- 130 Directors

1.iv. Organization of Quality Management (1)

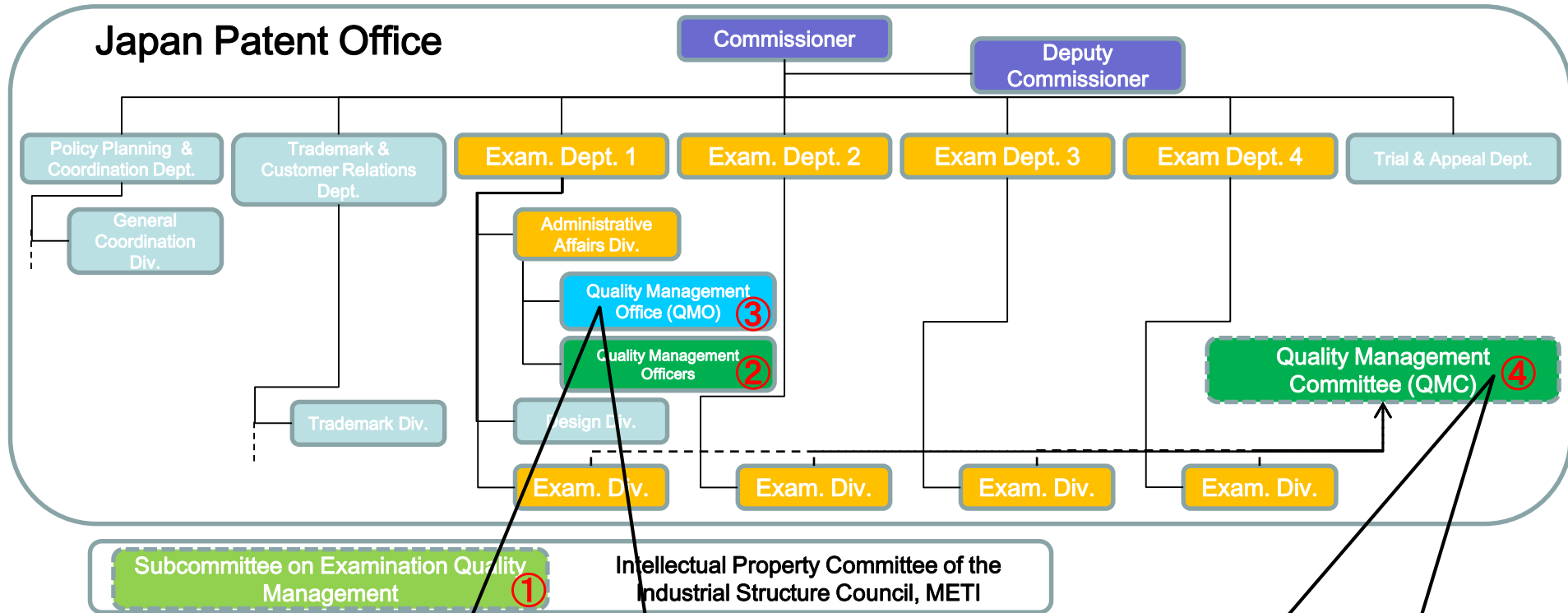


The JPO obtains

- objective feedback about its systems for
- its current state of quality management on patent examination from external experts

Around 90 Quality management Officers for quality audit

1.iv. Organization of Quality Management (2)



- 5 Examiners & 27 Researchers
- supporting initiatives
 - obtaining facts on examination processes
 - planning necessary initiatives

- 1 Chairperson & 12 Directors
- analyzing & evaluating data
 - reporting results
 - feedback to examiners

1. Quality Management System (QMS)

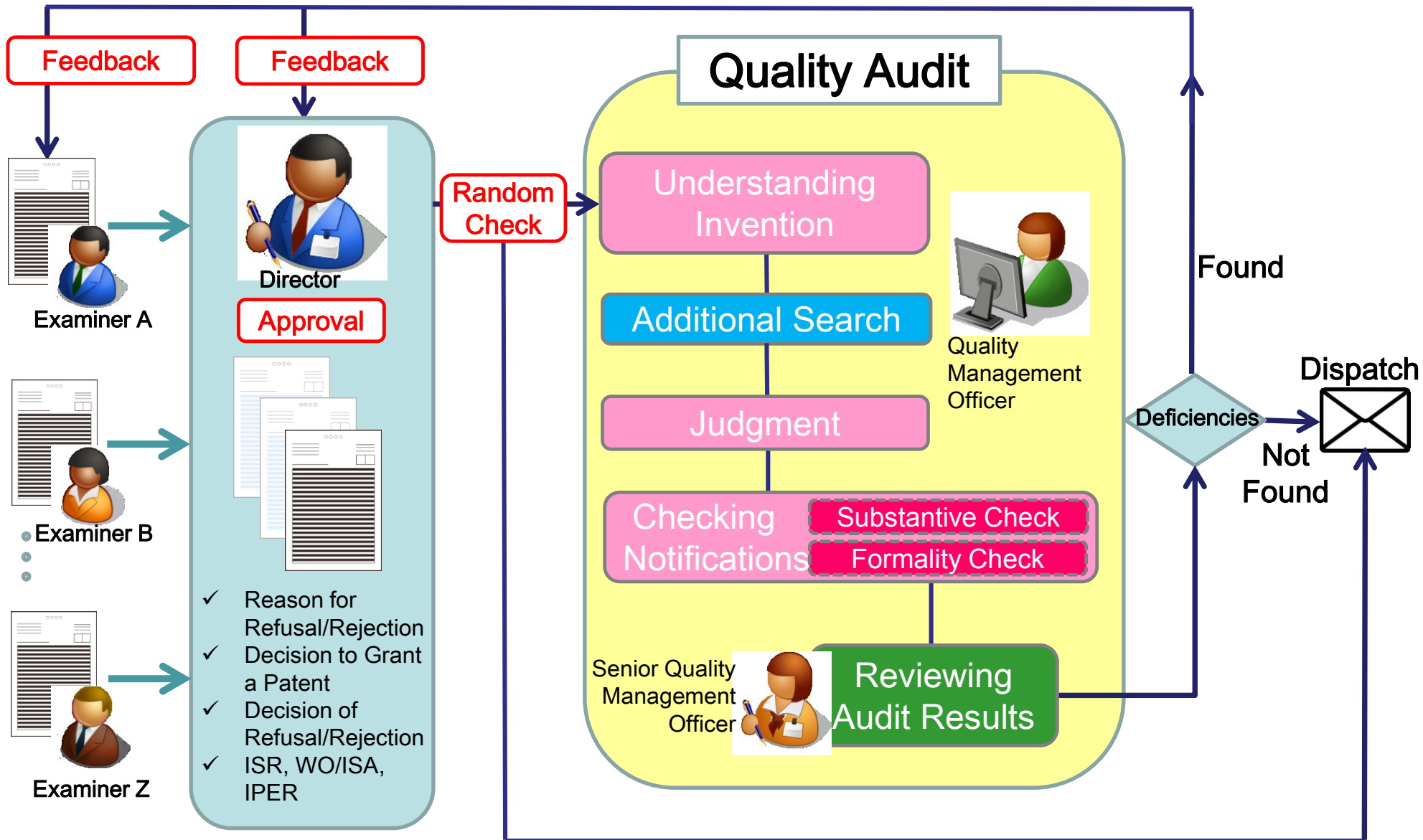
2. Quality Verification

- i. Quality Audit
- ii. Partial Audit
- iii. User Satisfaction Survey
- iv. Meeting with Users on Examination Quality
- v. Acceptance of Opinions on Examination Quality

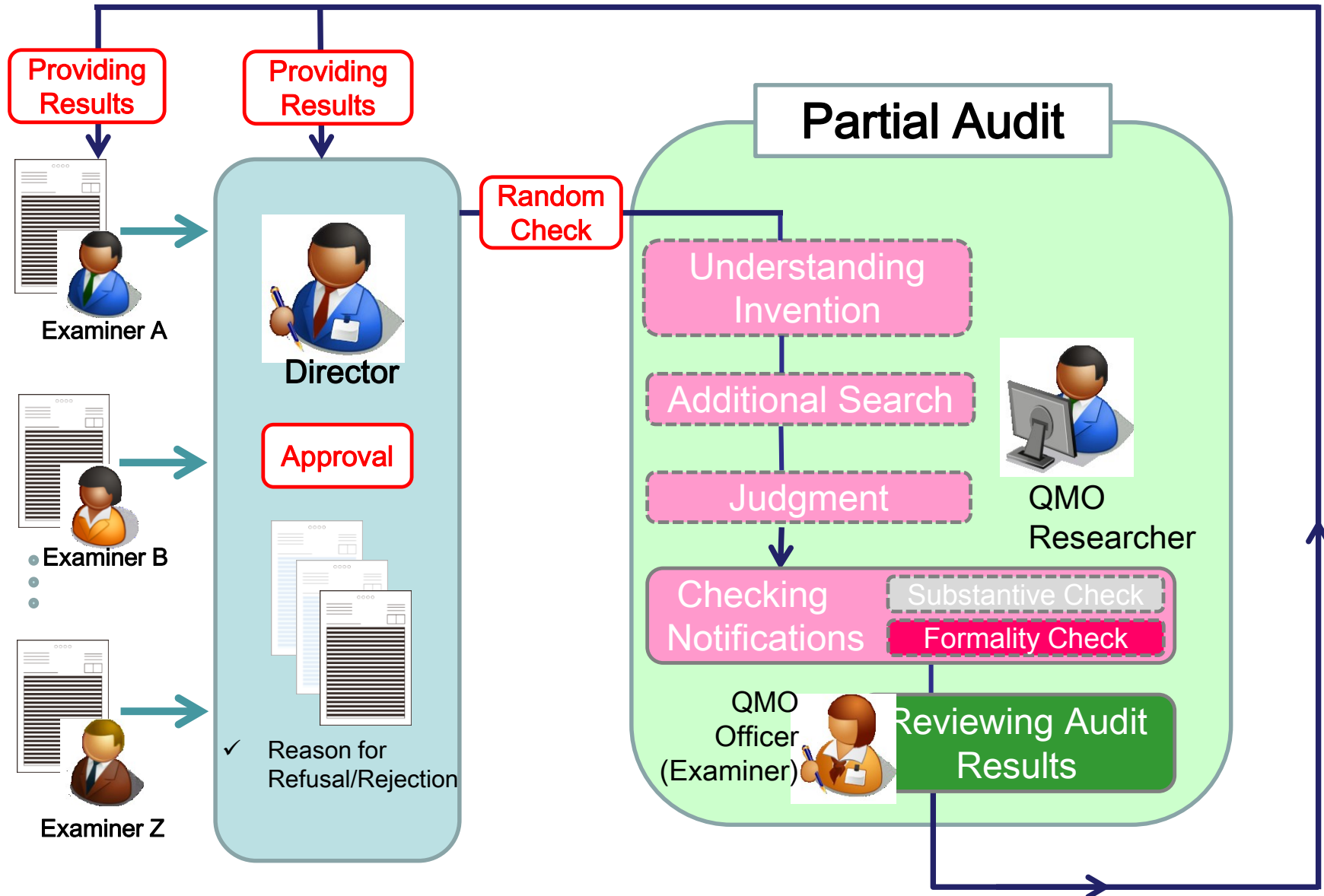
3. Quality Assurance

4. Continuous Enhancement

2. i. Quality Audit

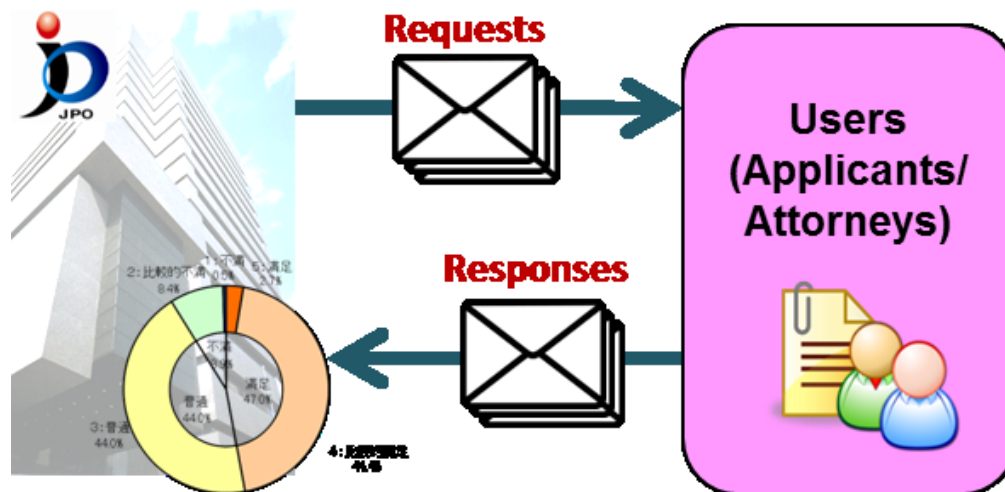


2. ii. Partial Audit



2. *iii. User Satisfaction Survey (1)*

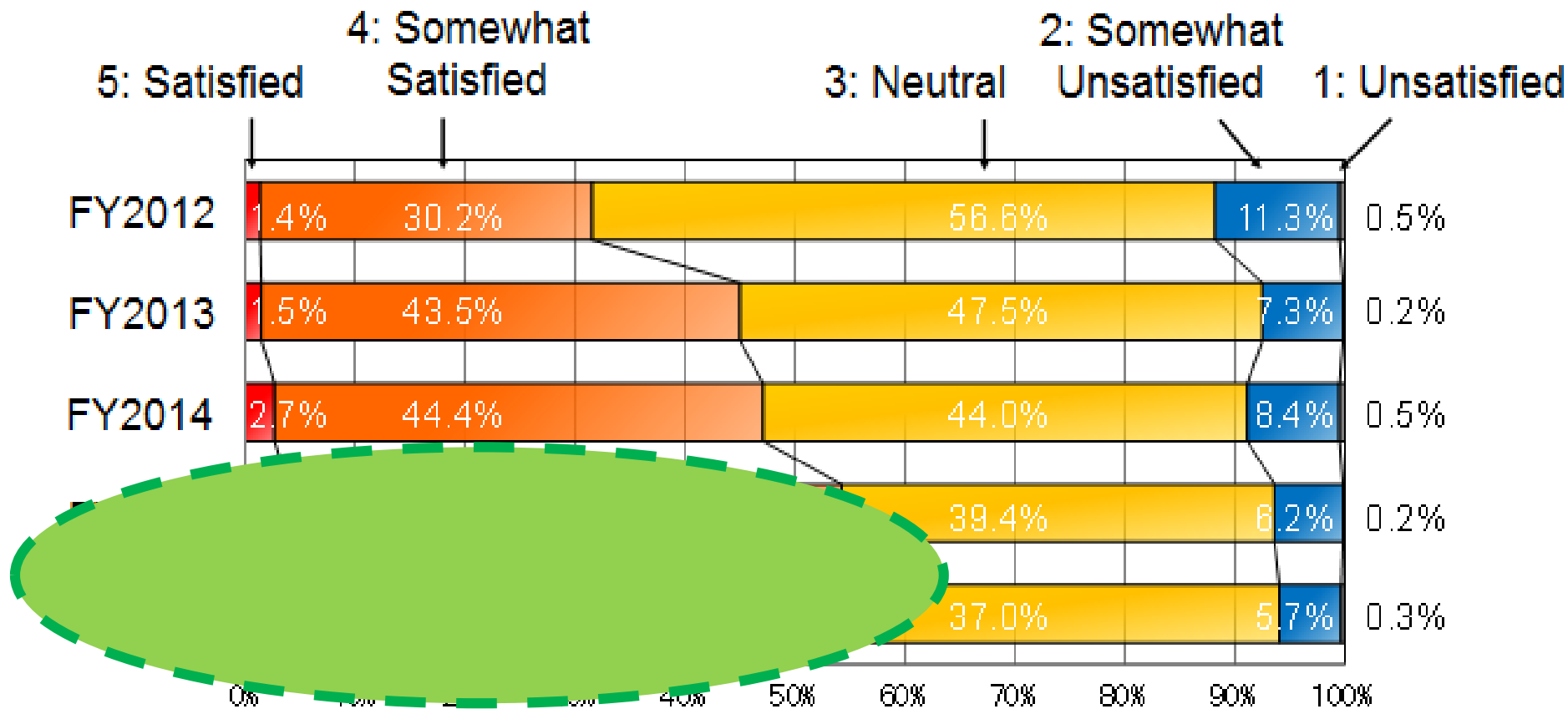
	Overall Quality in General	Quality on Specified Applications
National Applications	Sheet A	Sheet B
PCT Applications	Sheet C	Sheet D



High response rates of around 90%!!

2. iii. User Satisfaction Survey (2)

Overall Quality of Patent Examination on National Applications



> 50% !!!

Goals to Be Achieved by the JPO in Fiscal Year 2017

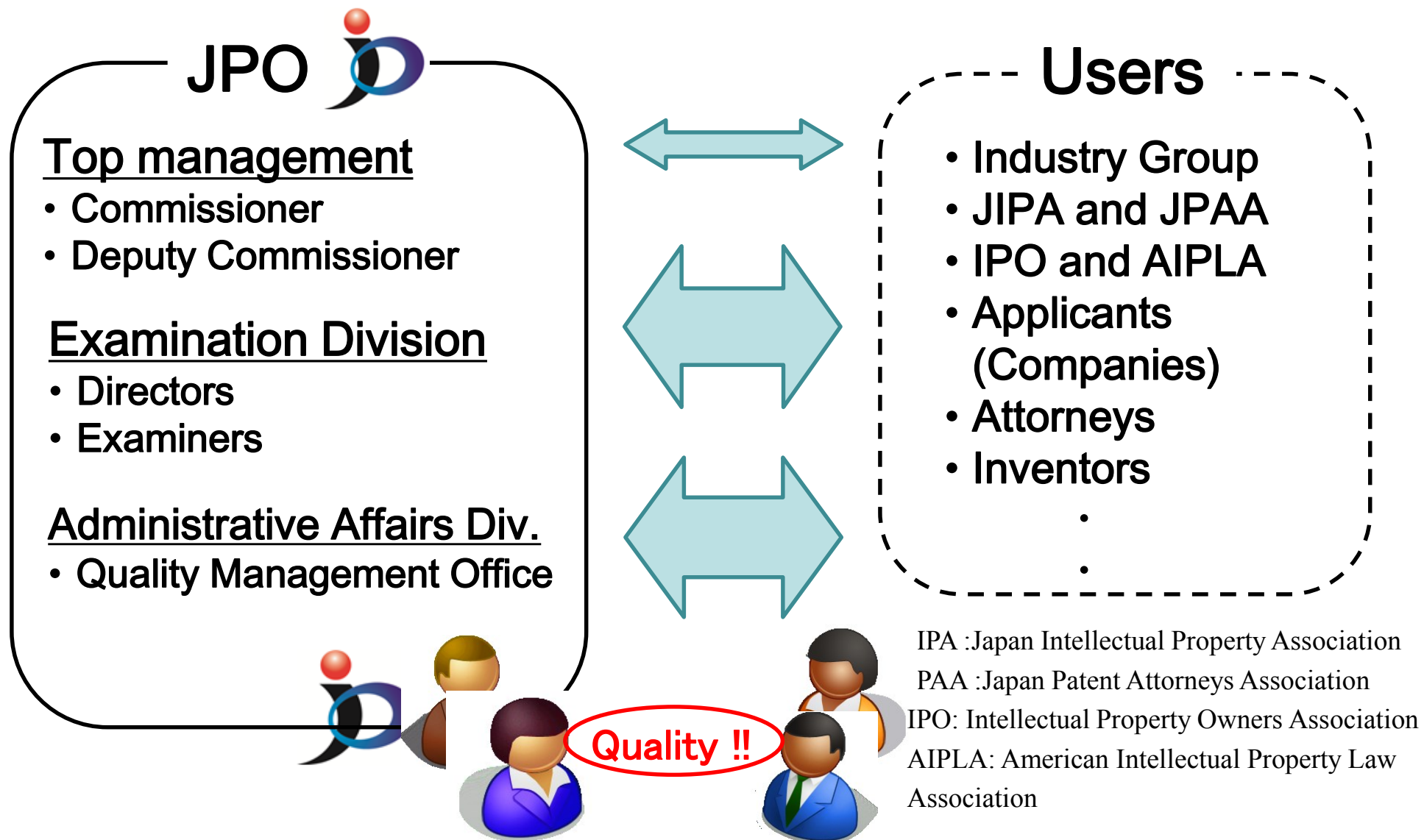
1. Patents

(1) Examination Pendency for Patent Applications <shorted>

(2) Quality of Patent Examinations

- In the JPO's survey on the quality of patent examinations, for the level of user satisfaction on communications with examiners, "the ratio of users who rated it as 4 and higher on a scale of 5 should be more than 60 %."
- The number of circuit interview examinations and video-conferencing examinations are to be "more than 700."

http://www.meti.go.jp/policy/policy_management/jissityou-hyouka/29fy-mokuhyou/29fy-jissityou-mokuhyou.pdf (Japanese version only)





特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

文字の大きさ | 印刷 | 投書箱(ご意見・ご要望) | ホームページの使い方 | アクセスマップ

検索 | 用語解説 | マイページ

ホーム | お知らせ | 制度・手続 | 施策・支援情報 | 資料・統計 | 特許庁について | お問い合わせ Q&A

模倣品・海賊版撲滅キャンペーン
だから、私は買わない
ニセモノは、かわいくない!
動画や事例でリスクを解説

目的別メニュー
特許検索
特許電子図書館 (IPDL)
特許文庫検索
特許システム (特許庁)
出願
料金
出願窓口 (手続関連)
特許庁への電子出願

ホーム > 投書箱(ご意見・ご要望)

投書箱(ご意見・ご要望)

特許庁及びこのホームページに対するご意見・ご要望がありましたら、こちらのお問い合わせリンクまでお寄せください。皆様からお寄せいただいたご意見・ご要望につきましては原則として、今後の参考とさせていただきます。

また、審査の質に関する御意見につきましては、「特許庁の審査品質管理」にて受け付けております。

なお、お問い合わせ・ご質問については、「お問い合わせ先一覧」を御参照いただき、各担当部署です。

Click!

このページの先頭へ

審査の質の向上のための御意見受付

特許庁では、審査の質に関する御意見を受け付け、質の向上のために活用しています。御意見がございましたら、以下の留意事項を御確認のうえ「[審査の質の向上のための意見提出フォーム\(外部サイトへリンク\)](#)」に御入力ください。なお、より正確に御意見の趣旨を把握できるように、出願番号を特定できるのであればフォームの出願番号欄に記入してください。

留意事項

(1) 提供いただいた御意見の取扱い

皆様からいただいた御意見につきましては、特許庁における今後の審査の質の向上の目的以外には使用いたしません。また、審査官に直接的に通知する等によって、本フォームへの御意見の提出が御意見提出者の不利益となることのないよう配慮します。御意見をいただいた内容について、個別に回答はいたしません。確認の連絡をさせていただくことがあります。

(注)

- 御自身の係属中の案件の権利取得に向けた御意見の提出又は審査結果の不服の申立てについては、法令に規定された意見書の提出又は拒絶査定不服審判の請求により行って下さい。
- 他者の係属中の案件に係る情報の提出については、法令に規定された情報提供制度(特許、商標)を御利用ください。

(2) 個人情報の取扱い

御入力いただいた個人情報は、御提供いただいた事例に係る問い合わせに際して使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。

[審査の質の向上のための意見提出フォーム\(外部サイトへリンク\)](#)

https://www.jpo.go.jp/sesaku_e/tousho_e.htm



JPO website & Telephone & FAX

1. Quality Management System (QMS)

2. Quality Verification

3. Quality Assurance

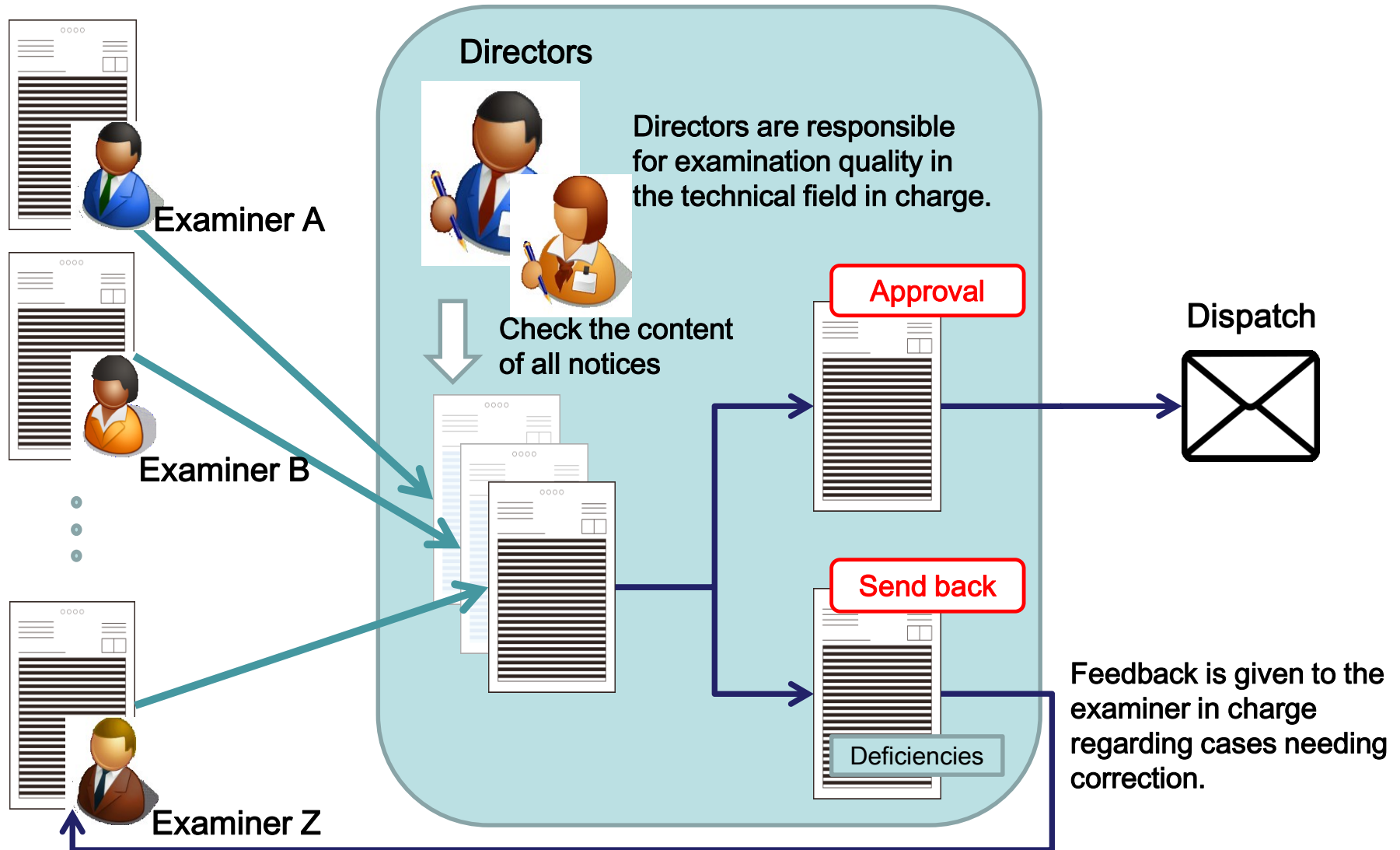
i. Approval

ii. Consultation

iii. Standardized Notification Form

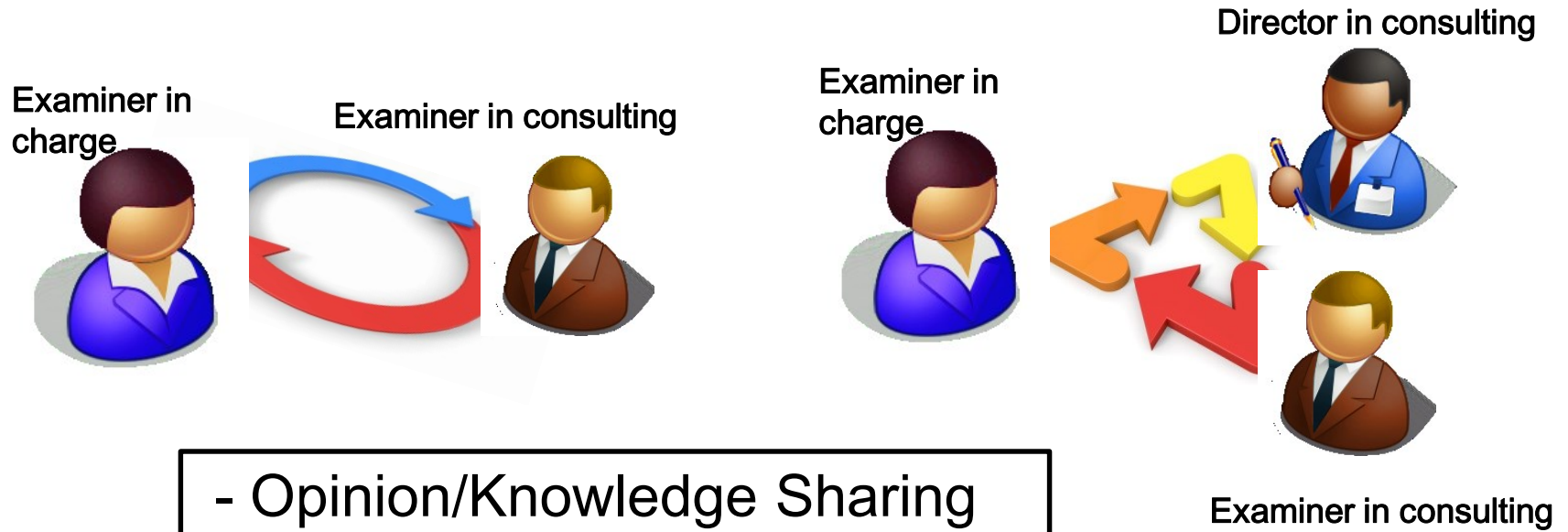
4. Continuous Enhancement

3. i. Approval



3. ii. Consultation

Around 50,000 cases (in FY 2016)



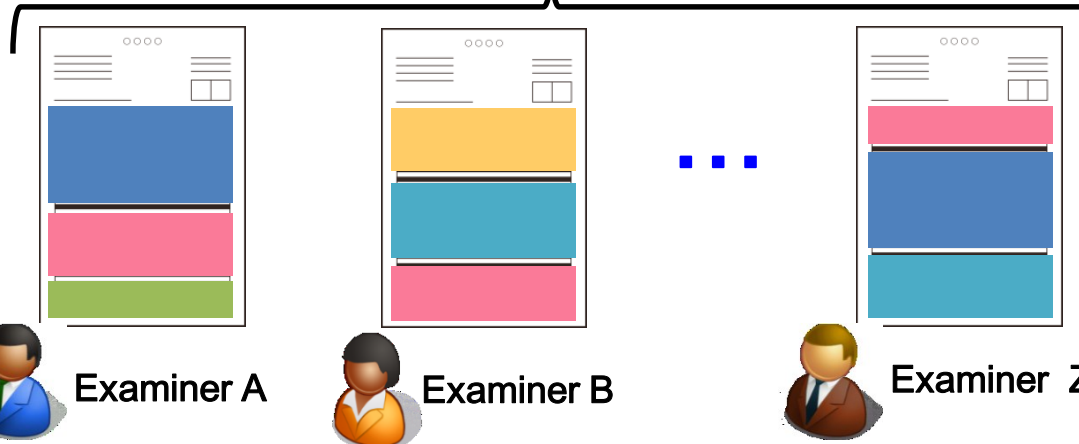
- Opinion/Knowledge Sharing
- Expertise in Search
- Reducing Discrepancies

※ Consultations are conducted not only with an examiner / examiners from the same Examination Division, but also with a Director or an examiner / examiners from a different Examination Division.

3. iii. Standardized Notification Form

Different Form

Before

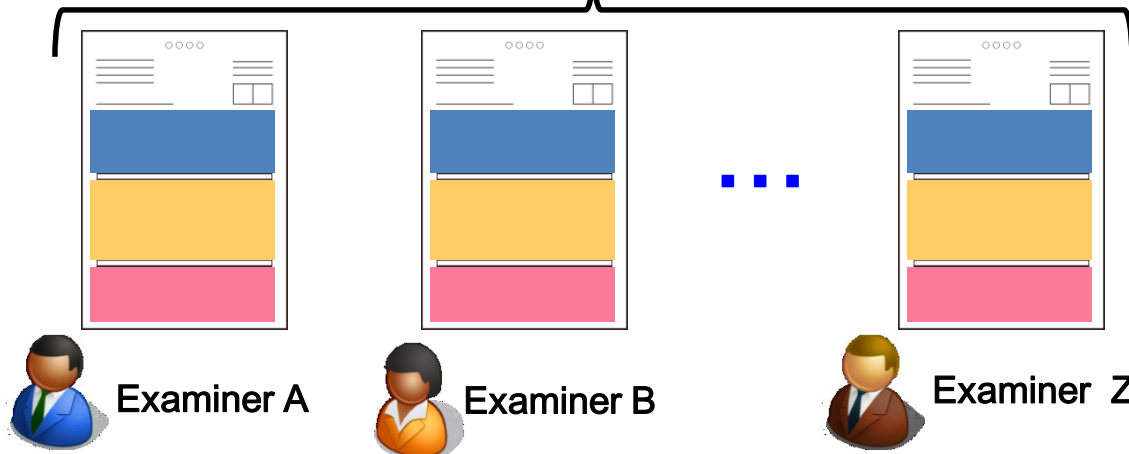


Applicant
/Representative



Same Form

After



Applicant
/Representative



1. Quality Management System (QMS)

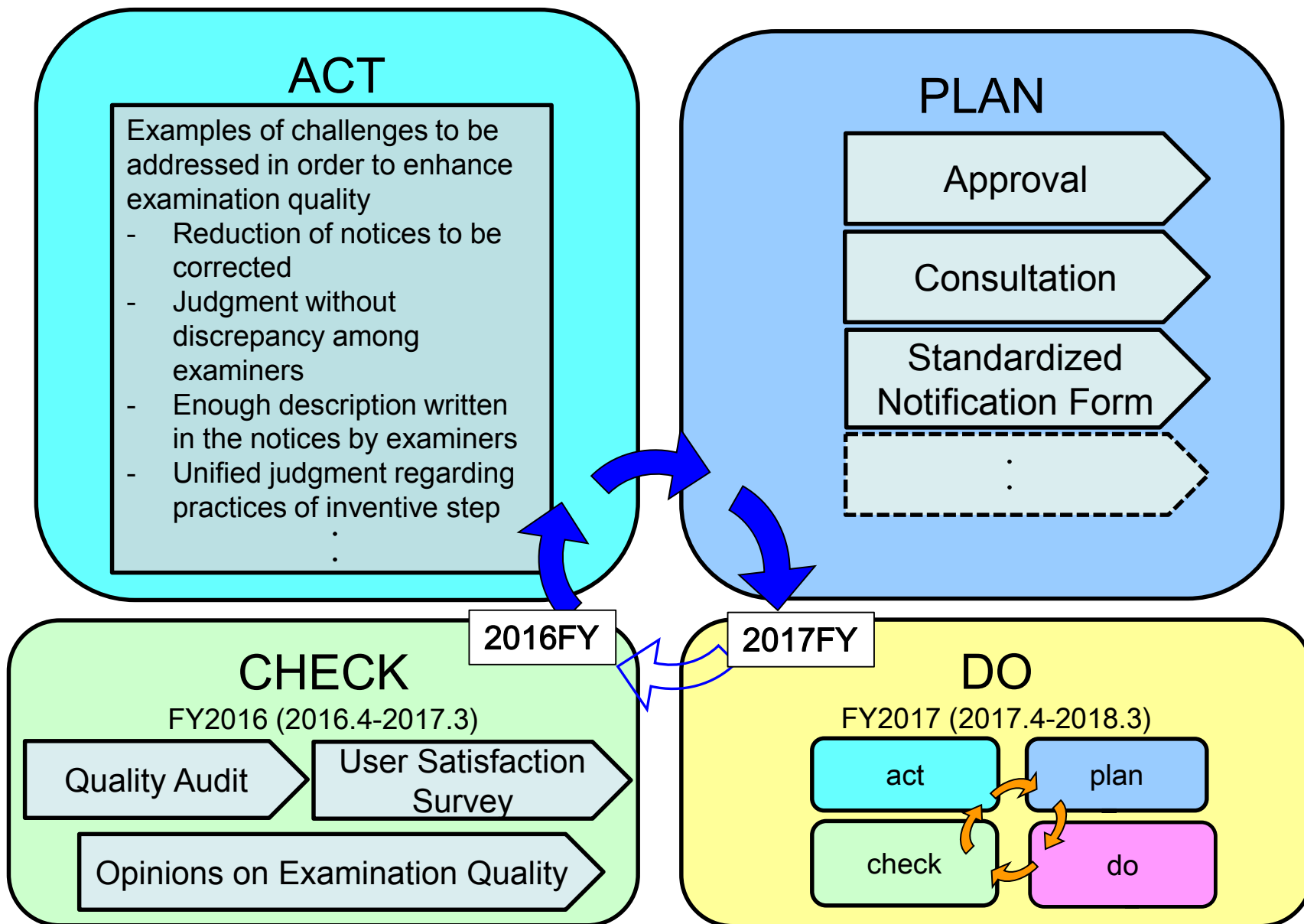
2. Quality Verification

3. Quality Assurance

4. Continuous Enhancement

- i. Continuous Enhancement by PDCA Cycles
- ii. Topic : Complete Update of Examination Guidelines

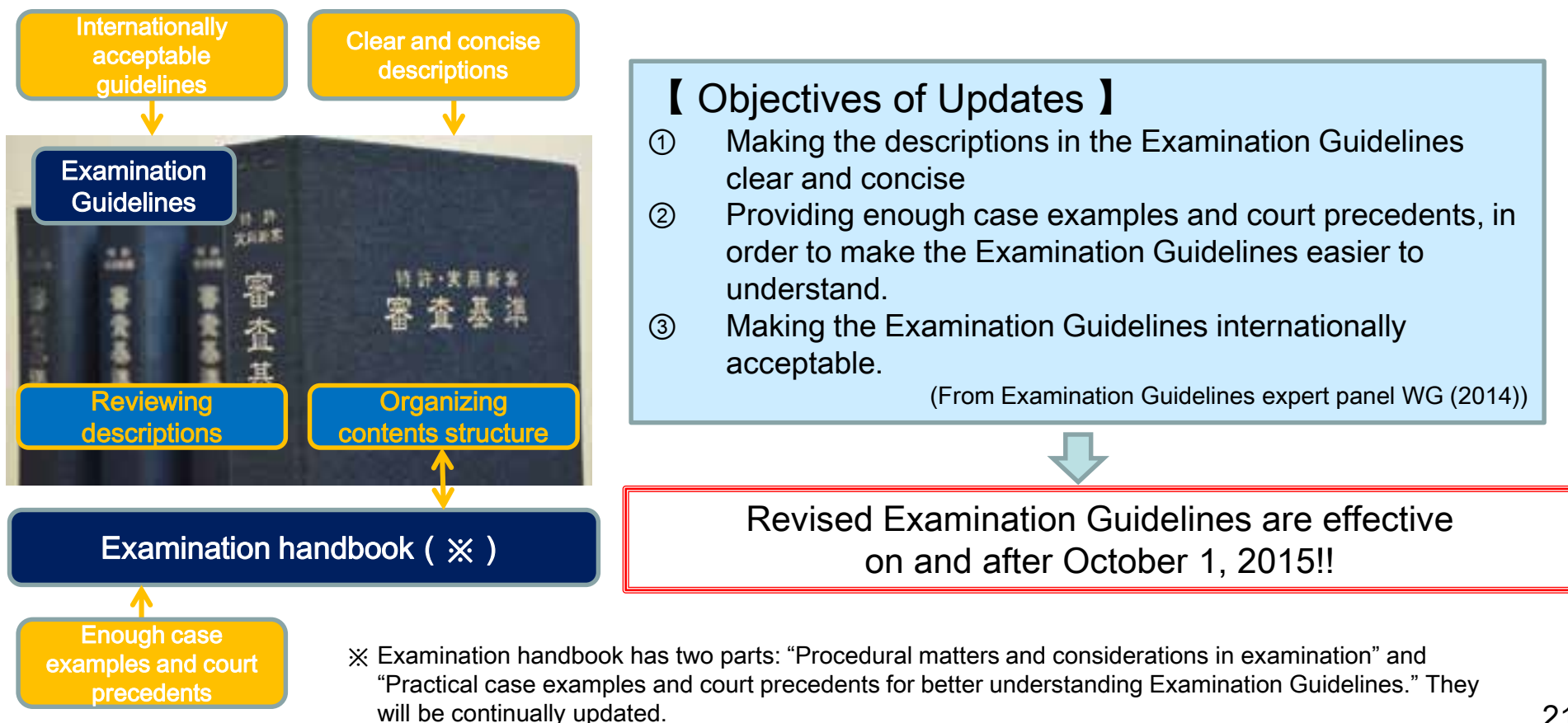
4. i. Continuous Enhancement by PDCA Cycles



JPO Operational Plan (FY2014 - FY2018)

④ Update of Examination Guidelines for Patents and Utility Models

To reduce discrepancies in examination practices /results and to establish easy-to-understand examination guidelines for improving applicants' understanding, JPO will update (clarified and simplified) its Examination Guidelines, adding more case examples and court precedents.



Thank you
for your attention!

JP 2900001 B2 2009.12.1

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 特許公報 (B2) (11) 特許番号
特許第2900001号
(P2900001)

(45) 発行日 平成21年12月1日 (2009.12.1) (24) 登録日 平成21年10月1日 (2009.10.1)

(51) Int. Cl. F I

<i>G 0 1 B 12/345 (2006.01)</i>	G 0 1 B 12/34	1 0 1 B
<i>G 0 2 C 9/87 (2006.01)</i>	G 0 2 C 9/87	Z N A
<i>G 0 1 B 67/89 (2006.03)</i>	G 0 1 B 67/89	Z
<i>G 0 1 B 12/345 (2006.03)</i>	G 0 1 B 12/345	U
<i>G 0 1 B 34/56 (2007.01)</i>	G 0 1 B 34:56	

請求項の数 2 (全 6 頁) 最終頁に続く

<p>(21) 出願番号 特願平11-123456 (22) 出願日 平成11年12月20日 (1999.12.20) (65) 公開番号 特開2000-123456 (P2000-123456A) (43) 公開日 平成12年6月20日 (2000.6.20) 審査請求日 平成12年8月18日 (2000.8.18) (31) 優先権主張番号 83304359.9 (32) 優先日 平成10年11月12日 (1998.11.12) (33) 優先権主張国 フランス (FR) (31) 優先権主張番号 96/12583 (32) 優先日 平成8年12月4日 (1996.12.4) (33) 優先権主張国 米国 (US)</p> <p>微生物の受託番号 FERM BP-3235 微生物の受託番号 NRRL B-18292 微生物の受託番号 NRRL B-18222</p>	<p>(73) 特許権者 390000011 特実 花子 東京都千代田区霞が関4-2-1</p> <p>(74) 代理人 123456789 弁理士 代理 太郎</p> <p>(72) 発明者 発明 太郎 神奈川県横浜須賀町1丁目2200番地</p> <p style="text-align: center;">審査官 審査 太郎</p>
--	--

(54) 【発明の名称】 ファクシミリ走査装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等によ
ラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する
含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ
ィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離する
ータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファク
定の識別コードを検出し、該ファクシミリ情報フィール
の端末パラメータの内容を検出することを特徴とするフ
式。

【請求項2】

請求項1の装置を用いる方法・・・・。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は簡単にして、装置機能のパラメータの拡張が容易なファク
識別方式に関するものである。

